PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-269520

(43)Date of publication of application: 20.09.2002

(51)Int.Cl.

G06K 19/07 B42D 15/10 G06K 19/077 H01L 23/29 H01L 23/31

(21)Application number: 2001-069615

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

13.03.2001

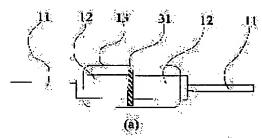
(72)Inventor: USAMI MITSUO

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

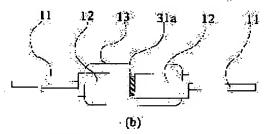
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide high reliability electronic device and to provide a manufacturing method for electronic device, capable of facilitating its manufacture.

SOLUTION: This electronic device comprises a flat semiconductor 31 and Dumets wires 12 connected to connecting terminals on both sides of the semiconductor and lead wires 11, which are sealed in a glass tube 13.



. 図3



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-269520 (P2002-269520A)

(43)公開日 平成14年9月20日(2002.9.20)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
G06K 19/07		B 4 2 D 15/10	521 2C005
B 4 2 D 15/10	5 2 1	G 0 6 K 19/00	H 4M109
G 0 6 K 19/077			K 5B035
H01L 23/29		H 0 1 L 23/30	G
23/31			

審査請求 未請求 請求項の数45 OL (全 11 頁)

(21)出顧番号	特願2001-69615(P2001-69615)	(71)出顧人 000005108	
		株式会社日立製作所	
(22)出顧日	平成13年3月13日(2001.3.13)	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地	
		(72)発明者 宇佐美 光雄	
		東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地	
		株式会社日立製作所中央研究所内	
		(74) 代理人 100075096	
		弁理士 作田 康夫	
	•	Fターム(参考) 20005 MA40 MB10 NA08	
		4M109 AA03 BA01 GA03	
		58035 AA00 AA04 BB09 CA23	
		1	

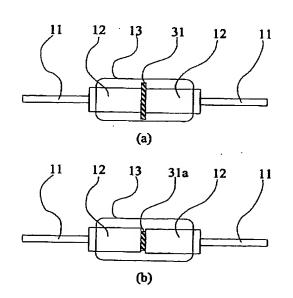
(54) 【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】本願発明の目的は、信頼性の高い電子装置を提供することにある。又、製造が容易な電子装置の製造方法を提供することにある。

【解決手段】平板状半導体31とその表および裏面の接続端子とリード線11に接続されたジュメット12とをガラス管13で封止した電子装置とする。

図3



【特許請求の範囲】

【請求項1】所定の情報を記憶するメモリ部と、表面側 及び裏面側にそれぞれ設けられた第1及び第2の外部電 極とを有する平板状ICチップと、

前記第1及び第2の外部電極にそれぞれ接続され、前記 ICチップへ電力を供給する第1及び第2のアンテナ Ł.

前記第1及び第2の外部端子側の前記第1及び第2のア ンテナのそれぞれの一部と前記ICチップとを被うよう に設けられたガラス封止体とを有することを特徴とする 10 電子装置。

【請求項2】前記ICチップの厚さは、0.1 μm~2 00μmの範囲であることを特徴とする請求項1記載の 電子装置。

【請求項3】前記ICチップの長辺の長さは、0.01 mm~0.5mmの範囲であることを特徴とする請求項 1又は2に記載の電子装置。

【請求項4】前記第1及び第2のアンテナの長さは互い に異なることを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記 載の電子装置。

【請求項5】前記第1及び第2の外部電極は、前記IC チップの表面側及び裏面側の全面にそれぞれ設けられて いることを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載の 電子装置。

【請求項6】前記第1及び第2のアンテナは、前記第1 及び第2の外部電極に接続されるジュメットと、前記ジ ュメットに接続されるリード線とをそれぞれ有すること を特徴とする請求項1乃至5の何れかに記載の電子装 置。

【請求項7】前記ジュメットの直径は、前記ICチップ 30 の対角線の長さよりも大きいことを特徴とする請求項6 記載の電子装置。

【請求項8】前記ジュメットの直径は、前記リード線の 直径よりも大きいことを特徴とする請求項6又は7に記 載の電子装置。

【請求項9】前記第1及び第2のアンテナを含む前記電 子装置の長さは、使用する搬送波の波長の半分となるよ うに設定されることを特徴とする請求項1乃至8の何れ かに記載の電子装置。

【請求項10】前記第1及び第2のアンテナは、前記1 Cチップの表面及び裏面に垂直となるように配置されて いることを特徴とする請求項1乃至9の何れかに記載の 電子装置。

【請求項11】前記第1及び第2のアンテナは、前記メ モリ部に記憶された所定の情報を送信するために用いら れることを特徴とする請求項1乃至10の何れかに記載 の電子装置。

【請求項12】前記第1及び第2のアンテナは、前記所 定の情報を送信する前に、ダミー信号を送信することを 特徴とする請求項1乃至11の何れかに記載の電子装

置。

【請求項13】前記ガラス封止体は、管状であることを 特徴とする請求項1乃至12の何れかに記載の電子装

2

【請求項14】前記ガラス封止体の外形寸法は、0.1 mm~5mmであることを特徴とする請求項13に記載 の電子装置。

【請求項15】前記ガラス管の内径寸法は、0.09m m~4.9mmであることを特徴とする請求項13又は 14 に記載の電子装置。

【請求項16】メモリ部と、前記メモリ部に電気的に接 続された外部電極とを有するICチップと、

前記外部電極に接続され、電波を送受信する導電線と、 前記ICチップを被うように設けられたガラス封止体 ٤٠

封止されているものがICチップであることが判別でき る識別子とを備えたことを特徴とする電子装置。

【請求項17】前記導電線と前記外部電極との接続部は 前記ガラス封止体で封止されていることを特徴とする請 求項16記載の電子装置。 20

【請求項18】前記導電線は、前記ガラス封止体から突 出して設けられていることを特徴とする請求項16又は 17に記載の電子装置。

【請求項19】前記ガラス封止体は管状であり、前記導 電線は、前記ガラス封止体の管の中心軸に沿って延在し ていることを特徴とする請求項18に記載の電子装置。

【請求項20】メモリ部と、第1の面及び前記第1の面 の反対側の第2の面にそれぞれ設けられた第1及び第2 の外部電極とを有するICチップと、

前記第1及び第2の外部電極にそれぞれ接続され、電波 を送受信する第1及び第2の導電線と、

前記ICチップを被うように設けられた管状のプラスチ ック封止体とを有することを特徴とする電子装置。

【請求項21】前記 I Cチップは、無線で動作する電子 回路を有することを特徴とする請求項20に記載の電子

【請求項22】前記電子回路への電力は、無線で供給さ れることを特徴とする請求項21に記載の電子装置。

【請求項23】前記電子回路は、前記外部電極及び論理 回路にそれぞれ接続される結合コンデンサを有すること を特徴とする請求項21又は22に記載の電子装置。

【請求項24】前記結合コンデンサは、整流ダイオート とクランプダイオードとを有することを特徴とする請求 項23に記載の電子装置。

【請求項25】前記クランプダイオードと前記論理回路 とは、それぞれ共通ラインに接続されていることを特徴 とする請求項24に記載の電子装置。

【請求項26】所定の情報を記憶するメモリ部と、表面 側及び裏面側にそれぞれ設けられた第1及び第2の外部 50 電極とを有する I C チップを準備する工程と、

一端にジュメットを有する第1及び第2のアンテナを準備する工程と、

ガラス管を準備する工程と、

前記第1のアンテナのジュメットの一部を前記ガラス管内に挿入する工程と、

前記ガラス管内に配置された前記第1のアンテナのジュメット上に、前記第1の外部電極が前記第1のアンテナのジュメット側となるように前記1Cチップを配置するする工程と、

前記ガラス管内に配置された前記ICチップ上に、前記 10 第2のアンテナのジュメットが前記第2外部電極側となるように前記第2のアンテナのジュメットの一部を挿入する工程と、

前記ガラス管を溶融して前記ICチップと前記第1及び 第2のアンテナのジュメットを固定する工程とを有する ことを特徴とする電子装置の製造方法。

【請求項27】前記ICチップの厚さは、0.1μm~200μmの範囲であることを特徴とする請求項26に記載の電子装置の製造方法。

【請求項28】前記ICチップの長辺の長さは、0.0 20 1mm~0.5mmの範囲であることを特徴とする請求 項26又は27に記載の電子装置の製造方法。

【請求項29】前記第1及び第2のアンテナの長さはそれぞれ異なるととを特徴とする請求項26乃至28の何れかに記載の電子装置の製造方法。

【請求項30】前記第1及び第2の外部電極は、前記1 Cチップの表面側及び裏面側の全面にそれぞれ設けられ ていることを特徴とする請求項26乃至29の何れかに 記載の電子装置の製造方法。

【請求項31】前記ジュメットの直径は、前記ICチップの対角線の長さよりも大きいととを特徴とする請求項26乃至30の何れかに記載の電子装置の製造方法。

【請求項32】前記ジュメットの直径は、前記リード線の直径よりも小さいことを特徴とする請求項31に記載の電子装置の製造方法。

【請求項33】前記第1及び第2のアンテナは、前記I Cチップの表面及び裏面に垂直となるように配置されていることを特徴とする請求項26乃至32の何れかに記載の電子装置の製造方法。

【請求項34】所定の情報を記憶するメモリ部と表面側 40 及び裏面側にそれぞれ設けられた第1及び第2の外部電 極とを有するICチップを、ガラス管内において第1及び第2のアンテナで挟み込み、その後ガラス管を溶融してICチップ及びそれらと第1及び第2のアンテナとの接続部を封止することを特徴とする電子装置の製造方法。

【請求項35】アンテナを介してICチップに設けられたメモリ内に記憶された情報が読み取られる電子装置において、前記メモリ含む集積回路は前記ICチップの主面に設けられ、前記アンテナは前記ICチップの主面お 50

よび裏面にそれぞれ設けられた電極に接続され、当該ICチップ及びそれぞれの前記電極と前記アンテナとの接続部はガラスによって封止されていることを特徴とする電子装置。

【請求項36】I C チップの中のメモリ部に記憶された自己認識情報が読み取られる電子装置において、前記メモリ部を含む集積回路は前記 I C チップの主面に設けられ、前記主面および前記 I C チップの裏面にそれぞれ設けられた電極にリード線がそれぞれ接続され、前記 I C チップ及びそれぞれの前記電極とリード線との接続部がガラスによって封止されていることを特徴とする電子装置。

【請求項37】平板状半導体チップ内のメモリ部に記憶された情報を、無線を利用して読み出す電子装置において、

前記平板状半導体チップは、その主面およびその裏面に それぞれ設けられた電極と、主面に対して垂直となるよ うに当該電極にそれぞれ接続されたリード線とを有し、 当該平板状半導体チップおよびリード線との接続部はガ ラスにより封止されていることを特徴とする半導体装 置。

【請求項38】前記平板状半導体チップは、その主面に無線により動作し、前記電極に接続される2つの端子を備えた回路素子を有することを特徴とする請求項37に記載の電子装置。

【請求項39】前記平板状半導体チップの厚さは、0.1 μmから200μmであることを特徴とする請求項37又 は38に記載の電子装置。

【請求項40】前記リード線の総長は当該の無線の搬送 波の波長の半分であることを特徴とする請求項37乃至 39の何れかに記載の電子装置。

【請求項41】前記ガラスの径は0.1mmから5mmであることを特徴とする請求項37乃至40の何れかに記載の電子装置。

【請求項42】前記平板状半導体チップの長辺は0.0 1mmから0.5mmであることを特徴とする請求項3 7乃至41の何れかに記載の電子装置。

【請求項43】読み出し機からトランスポンダに対して電波を発するとき、全く電波を出さないときから開始して電波を発するようにして、次に一旦電波を停止して、その時の状態から当該のトランスポンダから当該の読み出し機に当該のトランスポンダ内のデータを送付することを特徴とする電子装置の動作方法。

【請求項44】前記ガラス管を溶融する温度は、450 ℃以下であるととを特徴とする請求項34に記載の電子 装置の製造方法。

【請求項45】前記リード線の少なくとも表面は、銅であることを特徴とする請求項36に記載の電子装置の製造方法。

0 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、非接触で対象物を 認識する I C タグ等の電子装置、特に無線によって認識 番号を送る無体応答体(トランスポンダ)を搭載した電 子装置及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の高周波を用いて半導体チップ内部のメモリ部に記憶された情報を外部のリーダライタと非接触で交信する半導体タグ(ICタグ)の一例として、半導体チップが球形であり、当該半導体チップにダイボ 10 ール型の高周波アンテナが接続された非接触型半導体タグが特開2000-222540に開示されている。本ICタグでは、球形の半導体チップにアンテナが半田により機械的に取り付けられている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】前項で述べたようなダイボール型アンテナが球形の半導体に半田付けされた I C タグでは、次に述べるような課題のあることを見いだした。即ち、ダイボール型アンテナと球状の半導体の接続を行うとき、ダイボールアンテナの先端部分と球状の半導体の接続部との位置決めが必要であるが、球状の半導体であると、接続位置を決めるために複雑な手法が要求され、簡便にかつ経済的に位置決めを行うことが困難である。

【0004】又、集積回路が球形半導体の表面に形成されており、外部光の影響を受けやすい。

【0005】本願発明の目的は、信頼性の高い電子装置 を提供することにある。

【0006】本願発明の他の目的は、製造が容易な電子 装置の製造方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち代表的なものの概要は次の通りである。

【0008】アンテナを介して半導体チップに設けられたメモリ内に記憶された情報が読み取られる電子装置において、前記メモリ含む集積回路は前記半導体チップ(1Cチップ)の主面に設けられ、前記アンテナは前記ICチップの主面および裏面にそれぞれ設けられた電極に接続され、当該半導体チップ及びそれとリード線との接続部とはガラスによって封止された電子装置とする。【0009】又、所定の情報を記憶するメモリ部と、表面側及び裏面側にそれぞれ設けられた第1及び第2の外部電極とを有する平板状ICチップと、前記第1及び第2の外部電極にそれぞれ接続され、前記ICチップへ第2の外部電極にそれぞれ接続され、前記ICチップへ第2の外部端子側の前記第1及び第2のアンテナのそれぞれの一部と前記ICチップとを被うように設けられたガラス封止体とを有する電子装置とする。

【0010】又、所定の情報を記憶するメモリ部と表面 る。本図に示すように、無線チップ表面端子21は無線 側及び裏面側にそれぞれ設けられた第1及び第2の外部 50 チップ内の回路に設けられた結合コンデンサ22に接続

電極とを有する I C チップを、ガラス管内において第 1 及び第2のアンテナで挟み込み、その後ガラス管を溶融 して I C チップ及びそれらと第 1 及び第2のアンテナと

の接続部を封止する電子装置の製造方法とする。 【0011】なお、ここで言うガラスとは、【Cチップを封止するために用いられる材料であり、石英ガラス、硼珪酸ガラス、鉛ガラス等を用いることができる。特に、鉛ガラス等の低融点ガラスが望ましい。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明に係る電子装置の概略構成 を、図1(a)、図1(b)を用いて説明する。図1 (a)、図1(b)は、共に本発明に係る電子装置の断 面を示す図である。各図においてリード線11は台座 (ジュメット) 12に接続されて一体ものとして形成さ れており、アンテナをとなる。アンテナから電力を得て 動作するICチップ(無線チップ)14はジュメットに より挟まれた構造を有する。ガラス13は管状であり、 無線チップおよび、ジュメットの一部がガラス13で封 止されている。図1(a)では、無線チップ14の対角 線の長さがジュメット12の直径よりも大きく、図1 20 (b) では小サイズ無線チップ14aの対角線の長さは ジュメットの直径よりも小さい。ここでジュメットは無 線チップ14や小サイズ無線チップ14aを挟みやすく するために、リード線11よりも大きな直径を有する先 端金属部である。無線チップを板状とし、表面および裏 面に電極を設けることにより、ジュメットとの接続のた めの位置合わせを容易に行うことができる。無線チップ 14、小サイズ無線チップ14aをジュメット12で挟 むことにより、ICチップへの外部光の入射を低減でき 30 る。特に、小サイズ無線チップ14aの場合には、外部 光に対する遮蔽効果が大きい。ガラスの形状は筒型や直 方体等の自由形状で良いが、ICチップおよびジュメッ トが封入できる寸法の空洞を持つ必要がある。特に、ガ ラス管の開放端にICチップの表面及び裏面電極が面す る向きでガラス管内にICチップが封入できる大きさの 空洞を有することが好ましい。これにより、ジュメット でICチップを容易に挟み込むことができる。ガラスの 外径寸法は0.1mmから5mmの範囲とすることによ り、外部応力を受け難くく、取り扱い易い。特にタグと 40 して使用する場合、小寸法のため荷物を取り扱うときの 邪魔にならず、タグが紛失しにくい。又ガラス管の内径 寸法を0.09mmから4.9mmの範囲内とすること により、機械的な強度を確保することができる。

【0013】次に本発明に係る無線チップの概略構成を、図2(a)、図2(b)を用いて説明する。なお、ここでは無線チップについて説明するが、小サイズ無線チップにおいても同様の構成とすることができる。図2(a)は、無線チップの回路構成の概略を示す図である。本図に示すように、無線チップ表面端子21は無線

6

されており、結合コンデンサ22は整流ダイオード23 とクランプダイオード25に接続されている。整流ダイ オード23は更に論理回路24に接続されている。論理 回路24には、整流ダイオード23を介して電流が供給 される。クランプダイオード25および論理回路24は 共通端子(本願明細書では共通端子のことを以下、グラ ンドと呼ぶ。) 26に接続されている。

【0014】図2(b)は図2(a)の回路を形成した 無線チップの概略断面図を示している。無線チップ表面 端子21は表面デバイス層27の上にあり、またグラン 10 ド26は無線チップ14の裏面に存在する。グランド2 6はジュメットを介して外部のリード線と接続され、同 様に無線チップ表面端子21はジュメットを介して外部 のリード線と接続される。図2(a)の無線チップ表面 端子21とグランド26の二つの端子は外部のアンテナ と接続することにより、通信距離を確保することができ る。高周波電磁波エネルギをアンテナによって得て、無 線チップ内の整流回路によって直流電流を得ることがで きる。これにより、無線チップは電池なしで動作が可能 となる。この回路のグランド端子は半導体チップの基板 20 に接続される。無線チップの電極端子は半導体チップの 表面および裏面に形成されており、電極端子の物理的面 積は最大無線チップの平面サイズ(チップ全面)まで拡 大される。電極端子面積が大きい程電極材料により遮蔽 される領域が大きくなり、外部からの光の影響を小さく することができる。

【0015】本発明に係る他の電子装置の概略構成を、 図3(a)、図3(b)を用いて説明する。図3

(a)、図3(b)は、共に本発明に係る電子装置の断 面を示す図である。ことに示す符号で、図1と同じもの は同じ構成を示す。なお、符号31は、薄膜化された薄 型無線チップを、又、符号31aは薄膜化された薄型小 サイズ無線チップを表す。薄膜化することにより、無線 チップの側面からの外部光の影響を低減することができ る。

【0016】図1(a)、図1(b)や図3(a)、図 3 (b) に示した電子装置に I C チップが封止されてい ることを示す識別子を設けることにより、ガラス管内に 封止されているチップが I Cチップであることを明確化 することができる。識別子として、マークをガラス表面 40 に施すことができる。色により区別してもよい。図1 (a)、図1 (b) および図3 (a)、図3 (b) では 無線チップのすべてまたは中心部が金属製のジュメット で表面および裏面が覆われ、金属は光を透過することが 無いために、無線チップが光によって誤動作などの障害 を起こすことを防ぐことができる。ジュメットに比較し て無線チップがジュメットより小さい図1(b)や図3 (b) に示した構造とすることにより光に対して十分に 強い構造とすることができる。図1(a)、図1(b) や図3(a)、図3(b)の構造では無線チップがガラ 50 と、クランプダイオード25に接続された上部電極と、

スによって機密封止され、かつ無線チップの両端が固い ジュメットによって挟まれるため、耐腐食性や機械的強 度に対して十分良好な信頼性を確保することができる。 【0017】次に、図2(a)で示された論理回路24 の構成例を図4を用いて説明する。メモリ回路42はク ロック抽出回路43からのクロック信号によって動作し て、出力信号はロードスイッチ44に入力されて、負荷 変動動作を行う。

【0018】また、平滑コンデンサ45は整流ダイオー ド23のカソードとグランド26の間に挿入されてい て、整流回路(ここでは、整流ダイオード)からの直流 電流を蓄積して直流電圧を発生させている。直流電圧は 0. 3 V程度から30 V以上まで、無線チップが得るエ ネルギによって上昇するが、過度な電圧であると、論理 回路24のMOSデバイスのゲート破壊を引き起こすた めに、電圧を抑制する回路も必要に応じて付加される。 【0019】平滑コンデンサ45は電源電圧の安定化の ためにも必要であって、論理回路24の動作で発生する CMOS論理のゲート回路に流れる貫通電流を吸収する ことも行なわれる。メモリ回路42はメモリ容量や読み 出し専用か、書きこみ可能かなどの仕様によってさまざ まな構成を得ることが出来る。クロック抽出回路43は 読み取り機からトランスポンダ(アンテナを備えた無線 チップ) に送られてくる高周波の搬送波にクロック信号 を変調しておき、受信したトランスポンダのクロック抽 出回路が復調してもとの低周波のクロック信号を得るも のである。

【0020】次に、無線チップについて、図5(a)、 図5 (b)を用いて更に説明する。図5 (a)は無線チ ップ14の概略を示す平面図である。表面デバイス層2 7に無線チップの主面側電極端子21、それに接続され た結合コンデンサ22、それに接続されたクランプダイ オード25と整流ダイオード23、整流ダイオード23 に接続された論理回路が設けられている。図5(b)は 無線チップ14の要部断面図を示している。 絶縁膜(こ とではシリコン酸化膜) 51はチップ表面にあって、無 線チップ表面側電極端子21と無線チップの基板との短 絡を防止する。

【0021】図5 (b) は図5 (a) のAとA 'の断面 を示している。無線チップ14のチップサイズは長辺が 0.01mmから0.5mmであって、小さなガラス管 に入るような大きさであり、信頼性および経済性に優れ る。無線チップのサイズを、シリコンダイオードと同様 に0.3mm近辺とすることにより生産設備の共用化が 可能となり、低コストでトランスポンダを製造すること ができる。図5(b)で、無線チップの表面側電極端子 はメッキで形成された 1 0 μ m 程度の厚さの金属からな る。この厚さの範囲は0.1~50μmが好ましい。

【0022】表面側電極端子21に接続された下部電極

これらにより挟まれた絶縁膜(ここでは、シリコンの酸 化膜)とにより結合コンデンサ22が形成されている。 無線チップの基板をP型とすることにより、P型の基板 とN型を有する表面拡散層とでPN接合ダイオードを形 成することができる。このとき、基板をグランドとする ことができる。またN型MOSによっても基板をグラン ドとするデバイス設計を行ったダイオードを形成すると とができる。基板の裏面にはグランド26の電極を形成 して、回路の端子として使用する。このように無線チッ プの表面および裏面を電極とする設計をすることにより ガラス封止のトランスポンダを形成することが可能とな る。

【0023】次に、図3(a)、図3(b)で示した薄 型無線チップに関連して、図6を用いて無線チップの厚 さと電子装置の性能との関係について説明する。

【0024】図6は、無線チップの厚さを横軸にとり、 縦軸にトランスポンダと読み取り機の通信距離をとった ものである。ここで用いた周波数は、2.45GHzで ある。無線チップの厚さとトランスポンダ回路のグラン ド直列抵抗は比例関係にあって、このグランド直列抵抗 が小さければ通信距離は長くなり、グランド直列抵抗が 大きければ回路の損失抵抗が大きくなるため、通信距離 は小さくなる。チップ厚さが100μm以下であれば1 200mm、チップ厚さが200 μmのときは150m mとなる。

【0025】との通信距離は回路の構成、デバイスの性 能たとえばスレッショルド電圧や電流増幅率などにより 異なり、また無線チップの基板濃度によっても異なる。

【0026】また、リード線の材料によってもことな り、材料の主体が鉄の時は通信距離は無線チップの厚さ が200μmのとき、150mmであるのに対して、銅 にすると通信距離250mmに伸ばすことができる。こ れはリード線の損失はリード線の抵抗値に依存すること と、表面のメッキ状態に依存する。高周波の搬送波を利 用しているトランスポンダでは、スキン効果が発生して 電流が表面層に集中してリード線の表面の抵抗値に依存 するものであり、鉄を中心に使用して、銅メッキを施す と、無線チップの厚さが200μmのとき、通信距離は 200mmとなる。

【0027】なお、周波数が2.45GHzの場合、銅 40 メッキの厚さを2~3μmとすれば、銅そのものと同程 度の通信距離が得られる。

【0028】次に、無線チップの電極製造工程を図7 (a)~図7(d)を用いて説明する。図7(a)は、 複数の無線チップのデバイスが形成された半導体ウエハ の断面図を示している。図7(a)において、上側の面 が半導体ウエハ裏面71を示し、下側の面が半導体ウエ ハ主面72を示している。 ここでは半導体ウエハの厚さ を150 µmとしたが、0.1~300 µmの範囲で用 いることができる。主面側に複数の無線チップのデバイ 50 ッケル、鉄の合金に銅メッキを行ったものを用いた。ニ

スが形成されている。

【0029】図7(b)はウエハ裏面71の上に金蒸着 層73を形成した直後の断面図を示している。先ず、オ ーミックコンタクトを取るために金蒸着層73を形成し た。金蒸着層73の厚さは10μmとしたが、0.1μ mから80μmの範囲で用いることができる。0.1μ mより薄いと、接合強度が問題である。又、80μmよ り厚いと、ガラスとの熱膨張差が問題となる。引き続 き、金と銀との接着性を高めるためにアンチモン蒸着層 74を形成した。

10

【0030】図7(c)は金蒸着層73の上にアンチモ ン蒸着層74を形成した直後の断面図を示している。ア ンチモン蒸着層74の厚さは10μmとしたが、0.1 μ m から 8 0 μ m の範囲で用いることができる。 0. 1 μmより薄いと接合強度が問題である。又、80μmよ り厚いとガラスとの熱膨張差が問題となる。次に、ジュ メットとの接合性を高めるために銀蒸着層75を形成し た。

【0031】図7(d)はアンチモン蒸着層74の上に 銀蒸着層75を形成した直後の断面図を示している。銀 蒸着層75の厚さは10μmとしたが、0.1μmから 80μmの範囲で用いることができる。0.1μmより 薄いと接合強度が問題である。又、80μmより厚いと ガラスとの熱膨張差が問題となる。この工程は無線チッ プ14の裏面の電極を形成するために、ウエハ裏面全面 にメタル層を蒸着する工程を示している。このウエハは ダイシングテープに貼りつけられてチップサイズが0. 3mm角程度の無線チップにダイシングしたが、0.0 1mmから0.5mm角の大きさの範囲でダイシングす ることが可能である。0.01mmより薄いとハンドリ 30 ングし難い。又、0.6mmより厚いと寄生抵抗が問題 となる。ダイシングテープはPETや塩化ビニールが使 用されるが廃棄や焼却によて環境破壊を起こさないPE Tが使用することが望ましい。

【0032】図8 (a) ~図8 (d) を用いて、電子装 置の製造方法を説明する。先ず、リード線11に接続さ れ、垂直に立てられたジュメット12の上端をガラス管 13の下部から挿入する(図8(a))。ついで、ガラ ス管13に挿入されたジュメット12の上部に無線チッ ブ14を載せる(図8(b))。次に、ガラス管13の 上部からもろ一つのジュメット12を挿入し、無線チッ プ14を挟み込む (図8 (c))。 このときジュメット 12に印加される圧力は5~10MPaである。これに より、無線チップの主面および裏面に設けられたそれぞ れの電極とジュメットとは電気的に接続される。その 後、ガラス管13を高温で加熱し、ガラスを溶かしてジ ュメット12に付着させる(図8(d))。

【0033】上記の工程を経て、無線チップ14はガラ ス管13内に封止される。ここで、ジュメット12はニ ì

ッケルと鉄の合金を用いることにより、ジュメットやそ れを組み込んだ電子装置を磁石を用いて搬送することが できる。ガラスの融点はガラスの構成材料によって制御 できる。 ここでは、鉛ガラスを用いたので融点は約45 0℃である。

【0034】無線チップの配線材料として融点の低いア ルミまたはアルミとの合金を用いる場合には、450℃ 程度以下の温度で溶けるガラスや、サーマルシュリンク する材料 (例えば、プラスチック) を用いることが好ま しい。

【0035】無線チップは比較的高温に耐えるように、 水素アニールの水素が抜けないようにナイトライド膜を 無線チップの上に蒸着したり、アルミの配線の代わり高 温に耐える配線材料、たとえば銅とかタングステンとか チタンを使用することが有効である。

【0036】低融点のガラスを使用することにより、封 止温度を低下させることができ、無線チップへの熱的影 響を低減できるためトランスポンダの製造歩留まりを向 上させることが可能となる。図8(a)~図8(d)に より無線チップはガラス管の中に自重落下し、ジュメッ トとガラス管との間の位置合わせが可能であり、また複 数個すなわち数千から数万個を同時組み立てることが可 能であって、圧倒的な経済性のある組み立てが可能とな る。なお、治具131の一例を図13に示す。この治具 にはガラス管が挿入される開口部132が多数設けられ ている。

【0037】次に、リード長さ(アンテナの長さ)の通 信距離に及ぼす影響について図9を用いて説明する。と の図の横軸はトランスポンダのリードの長さを示してお り、縦軸はトランスポンダと読み取り機の間の通信距離 を示している。リードの長さは使用する搬送波の半分の 時が共振する条件として最もふさわしく(2.45GH zでは約6cm)、通信距離が大きい。それよりリード 長が小さくなるに従って通信距離は短くなるが、長くな る分には極端な通信距離の低下はみられない。リード長 としては、搬送波の1/2波長から1波長程度までを用 いることができる。

【0038】リード線の長さは全長で規定しているた め、図9で示すトランスポンダのリード線の左右の長さ は必ずしも等長である必要はない。また、図14に示す ようにリードを巻きたときには、リード線の最大直線距 離が搬送波の1/2波長から1波長となるように設定す ればよい。また、リード線の材質として磁化されやすい ニッケル、鉄などを用い、磁場の在る環境において動作 させたが、磁化されない材料を用いたときと比べトラン スポンダの性能に影響はなかった。これは、電界エネル ギによる電圧、電流がリード線で共振発生してガラス部 に封止された無線チップに集中し、エネルギーが高周波 で流れるためである。

【0039】次に、本発明に係る電子装置から記憶情報 を取り出すための読み取りシステムの一例を図10を用 いて説明する。図10において、符号101は電子装置 (ガラス封止トランスポンダ)、符号104はアンテ ナ、符号106は読み取り機、符号105は読み取り機 106とアンテナ104とを接続する同軸線、符号10 8はパーソナルコンピュータ、符号107はシリアルイ ンターフェースである。ガラス封止トランスポンダ10 1は読み取り機からの電波102によって電磁波のエネ 10 ルギを得ると、トランスポンダの無線チップが動作して 応答データ103がアンテナ104へ伝えられ、アンテ ナは同軸線105を介して読み取り機106へ接続され ている。ここで、使用周波数は2.45GHz、アンテ ナを含めた電子装置の長さは55mm、リード線の直径 は1mm、ガラス管の直径は3mmである。読み取り機 はシリアルインタフェース107を介してパソコン10 8へつなげられている。パソコンからは読み出し命令を 入力する。これにより、128ビットデータ(ROM) 情報が読み出される。このような構成により、トランス 示した組み立て方法では、治具を超音波で揺することに 20 ポンダはあらゆる対象物へ付着されて、宅配便や書留便 などに使用される。

> 【0040】図11はこのトランスポンダのエアフォマ ット(電波の強弱の手順)を示しており、図11のAは アンテナ104からの読み取り機からの電波102のエ アフォマットを示し、図11のBはトランスポンダ10 1からの応答データを示している。このデータは"0" や"1"の数字からなる。

【0041】図12は本発明の無線チップの断面構造を 示していて、無線チップの表面および裏面には金属製の 電極をもつことを特徴とする。なお、電極21はダイシ ング前に形成される。

[0042]

【発明の効果】平板状半導体を用いることにより、簡便 に位置決めを行うことができる。また、ガラス管で封止 することにより信頼性を向上できる。又、一括生産方式 により行うことによって、低コストでトランスポンダを 製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る電子装置の断面図である。

【図2】本発明に係るICチップの(a)回路、(b) 断面の概略を示す図である。

【図3】本発明に係る他の電子装置の断面図である。

【図4】本発明に係るICチップに搭載の論理回路の概 念図である。

【図5】【Cチップの(a)回路の概念図、(b)断面 図である。

【図6】本発明に係る | Cチップの厚さと通信距離との 関連を示す特性図である。

【図7】本発明に係るICチップの電極形成工程を示す 50 断面図である。

(b)

【図8】本発明に係る電子装置の組立工程を示す断面図 である。

【図9】本発明に係る電子装置のリード総長と通信距離 との関係を示す特性図である。

【図10】本発明に係る電子装置から記憶情報を取り出 すための読み取りシステムの示す図である。

【図11】本発明に係る(a)読み取り機から電子装置への送信データ、(b)電子装置からの応答データのエアフォーマットを示す図である。

【図12】本発明に係るICチップの概略断面図である。

【図13】本発明に係る電子装置を組み立てるための治 具の平面図である。

【図14】本発明に係る電子装置のリード線が曲線形状を有するときのアンテナ長を示すための説明図である。*

[図1]

図1

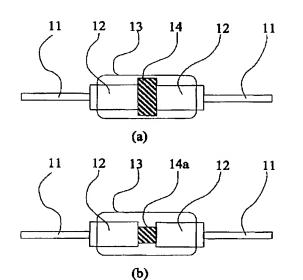


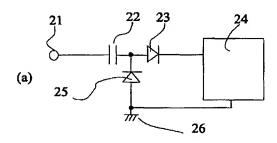
11…リード線、12…ジュメット、13…ガラス管、14…無線チップ、14a…小サイズ無線チップ、21 …無線チップ表面電極端子、22…結合コンデンサ、2 3…整流ダイオード、24…論理回路、25…クランプ ダイオード、26…グランド、27…表面デバイス層、 31…薄型無線チップ、31a…小サイズ薄型無線チップ、42…メモリ回路、43…クロック抽出回路、44 …ロードスイッチ、45…平滑コンデンサ、51…酸化 10 膜、71…ウエハ裏面、72…ウエハ主面、73…金蒸 着層、74…アンチモン蒸着層、75…銀蒸着層、10 1…ガラス封止トランスポンダ、102…読み取り機からの電波、103…応答データ、104…アンテナ、1 05…同軸線、106…読み取り機、107…シリアル インタフェース、108…パソコン。

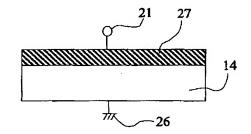
14

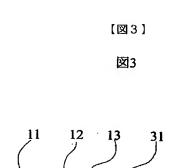
[図2]

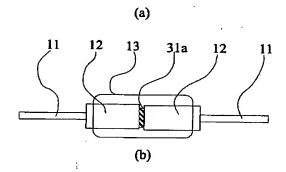
図2



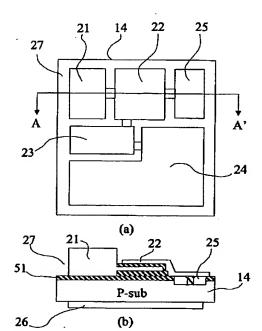






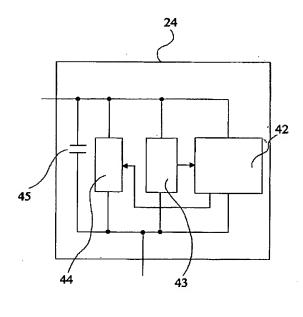






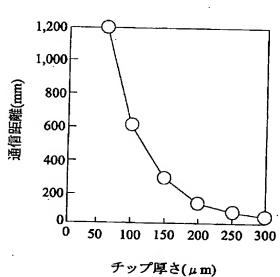




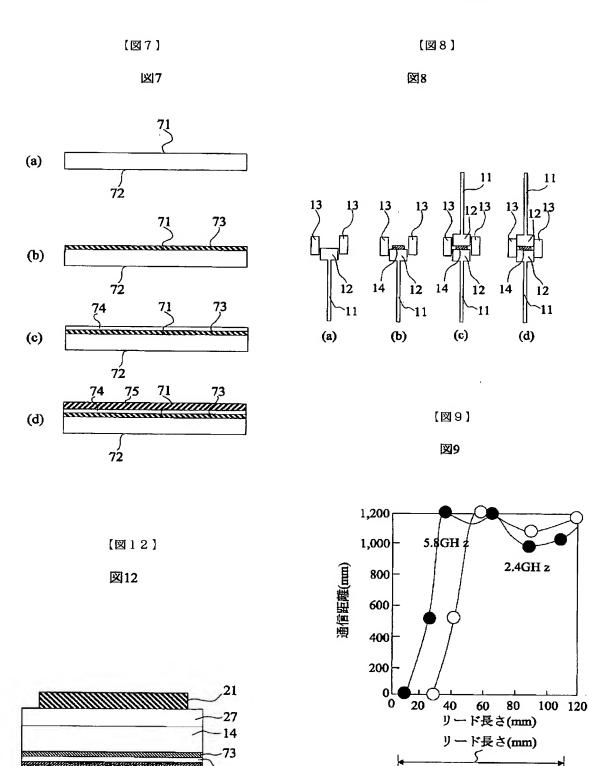


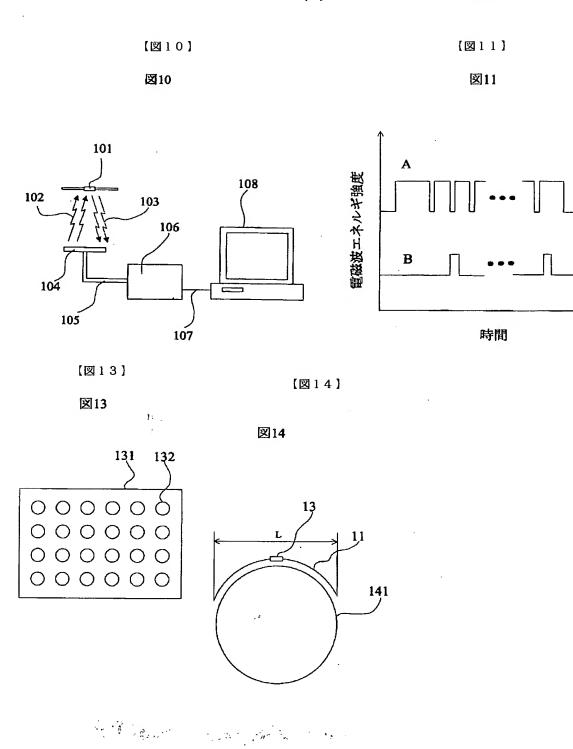
【図6】

図6



Ĺ





mis Page Blank (uspto)